

## Lizenzvertrag

Die Software RefDex (RefDex) wurde am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Deutschland, entwickelt. 2019 wurde RefDex von der Universität Duisburg-Essen (UDE), Universitätsstraße 2, 45161 Essen, die das alleinige Recht zur Verbreitung von RefDex hält, lizenziert.

RefDex dient insbesondere der Berechnung von optischen Eigenschaften dünner Schichten.

Die Nutzung von RefDex ist erst möglich, wenn die folgenden Regelungen durch den Nutzer akzeptiert werden:

1. Die UDE erteilt dem NUTZER eine Lizenz zur Benutzung von RefDex (ohne Quellcode).
2. Der NUTZER erhält von der UDE eine nicht ausschließliche, zeitlich unbefristete, nicht übertragbare, unwiderrufliche und unentgeltliche Lizenz, RefDex für eigene Forschungszwecke zu nutzen.
3. Die bestehenden Eigentums- und Urheberrechte bleiben von diesem Lizenzvertrag unberührt.
4. Die UDE überlässt dem NUTZER die Software „so wie sie ist“, ohne Verpflichtung seitens der UDE, eventuell auftretende Fehler zu korrigieren, die beim zukünftigen Gebrauch von RefDex auftreten könnten.
5. Dem NUTZER ist es untersagt, RefDex zu verändern, anzupassen, zu übersetzen oder auf Basis von RefDex ohne ausdrückliche Erlaubnis der UDE abgeleitete Arbeiten zu erschaffen.
6. Der NUTZER verweist einen an der Nutzung von RefDex ebenfalls interessierten Dritten auf die Website der UDE, insbesondere die Arbeitsgruppe Experimentalphysik / MultioptiX.
7. Bei geplanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen des NUTZERS, basierend auf der Anwendung von RefDex, hat der NUTZER eine der nachgenannten Veröffentlichungen zu zitieren:

- P. Manley, G. Yin, M. Schmid "A method for calculating the complex refractive index of inhomogeneous thin films" *Journal of Physics D: Applied Physics* **47**(20), 205301 (2014)
  - G. Yin, P. Manley, M. Schmid "Influence of substrate and its temperature on the optical constants of  $\text{CuIn}_{1-x}\text{Ga}_x\text{Se}_2$  thin films" *Journal of Physics D: Applied Physics* **47**(13), 135101 (2014)
  - G. Yin, C. Merschjann, M. Schmid "The effect of surface roughness on the determination of optical constants of  $\text{CuInSe}_2$  and  $\text{CuGaSe}_2$  thin films" *Journal of Applied Physics* **113**, 213510 (2013)
8. RefDex wurde nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt. Dies garantiert jedoch keine Fehlerfreiheit. Gewährleistungsansprüche an die UDE sind ausgeschlossen.
  9. Die UDE übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung von RefDex gemäß dieser Vereinbarung entstehen. Insbesondere haftet die UDE nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden aufgrund von Fehlern von RefDex.
  10. Der UDE sind keine Rechte Dritter bekannt, die dem Verwertungszweck vom NUTZER entgegenstehen. Die UDE haftet jedoch nicht dafür, dass die lizenzierte RefDex-Software frei von Rechten Dritter ist, insbesondere wenn RefDex Schutz- oder Urheberrechte Dritter verletzen sollte.
  11. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
  12. Für die Auslegung des Vertrages ist deutsches Recht anzuwenden. Für alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen, wird als Gerichtsstand Düsseldorf, Deutschland, vereinbart.

Essen, 24.9.19

Chloe Jelling